(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



I ABABA BUNDUR IN BUNDU DIRIK BANDI BANDI BANDI BUNDI IN BURBU DIRIK BURBU BUNDI BUNDUR BUNDI BANDI BANDI BANDI

(43) 国際公開日 2005年2月24日(24.02.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/017543 A1

(51) 国際特許分類7:

G01R 31/26

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/011843

(22) 国際出願日:

2004年8月18日(18.08.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

2003年8月18日(18.08.2003) 特願2003-294615

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会 社アドバンテスト (ADVANTEST CORPORATION) [JP/JP]; 〒1790071 東京都練馬区旭町一丁目32番 1号 Tokyo (JP).

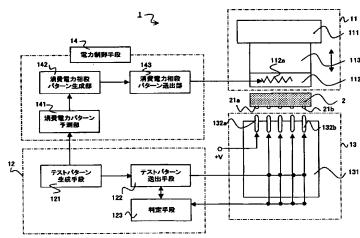
(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 安東 正和 (ANDO, Masakazu) [JP/JP]; 〒1790071 東京都練馬区旭町一丁 目32番1号株式会社アドバンテスト内 Tokyo (JP). 高橋弘行(TAKAHASHI, Hiroyuki)[JP/JP]; 〒1790071 東京都練馬区旭町一丁目32番1号 株式会社ア ドバンテスト内 Tokyo (JP). 山下 毅 (YAMASHITA, Tsuyoshi) [JP/JP]; 〒1790071 東京都練馬区旭町一丁 目32番1号 株式会社アドバンテスト内 Tokyo (JP). 橋本 隆志 (HASHIMOTO, Takashi) [JP/JP]; 〒1790071 東京都練馬区旭町一丁目32番1号株式会社アド バンテスト内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 前田均, 外(MAEDA, Hitoshi et al.); 〒 1010064 東京都千代田区猿楽町2丁目1番1号 桐 山ビル2階前田・西出国際特許事務所 Tokyo (JP).

(54) Title: TEMPERATURE CONTROL DEVICE AND TEMPERATURE CONTROL METHOD

(54) 発明の名称: 温度制御装置及び温度制御方法



14...POWER CONTROL MEANS 142...POWER CONSUMPTION SETOFF PATTERN GENERATION SECTION 143...POWER CONSUMPTION SETOFF PATTERN TRANSMISSION SECTION

141...POWER CONSUMPTION PATTERN PREDICTION SECTION

121...TEST PATTERN GENERATION MEANS 122...TEST PATTERN TRANSMISSION MEAN 123...JUDGMENT MEANS

(57) Abstract: A heater (112) has a temperature characteristic equal to or similar to the temperature characteristic of an electronic part (2) to be tested by a test pattern. While keeping the heater (112) in contact with the electronic part to be tested, the electronic part is pushed against contact terminals (132a, 132b). In this state, the test pattern is transmitted to the electronic part to be tested and the heater power consumption is controlled so that the sum of the power consumption of the electronic part to be tested and the power consumption of the heater is a constant value.

(57) 要約: テストパターンによる被試験電子部品(2)の温度変化特性と等しいか又は似する温度変化特性を有す るビータ(112)を被試験電子部品に接触させながら被試験電子部品をコンタクト端子(132a,132b) へ押し付け、この状態で被試験電子部品にテストパターンを送出すると





- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY,

KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), $\exists - \Box \gamma / (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).$

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。